

# Лабораторная работа №23 Изучение основных электрофизических характеристик полупроводника

# Студент:

Исламов Сардор – бригада 5 Физтех-школа физики и исследований им. Ландау Московский Физико-Технический Институт **Аннотация.** В данной работе с помощью втоматизированной установки для гальваномагнитных измерений в области температур 80-300 К определены основные электрофизические характеристики (тип проводимости, концентрация и подвижность носителей заряда) полупроводника. Изучен механизм протекания тока в полупроводниковых кристаллах в зависимости от легирования и температуры.

#### Экспериментальная установка

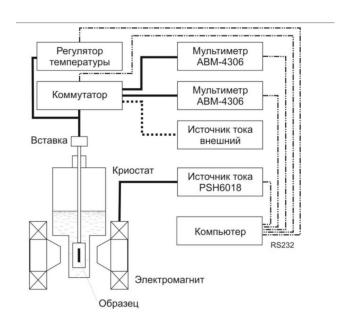


Рис. 1: Блок-схема автоматизированной установки для холловских измерений

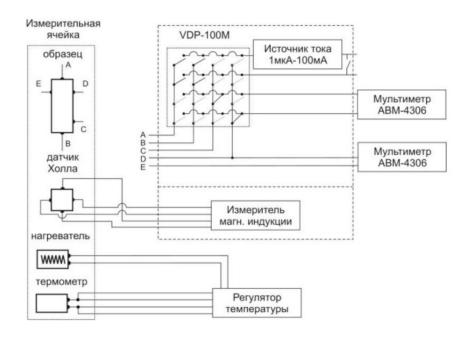


Рис. 2: Схема построения измерительной ячейки в установке

### Результаты измерений и обработка данных

Оригинальные измерения проводились с температуры 79.9 K до комнатной температуры. В данной работе заимствованы данные более ранних результатов студентов курса "Стекло".

По полученным в ходе эксперимента данным построим графики зависимости концентрации и подвижности носителей заряда от температуры (рис. 3) и установим тип проводимости. Теоретическая оценка концентрации носителей заряда при  $T=300~\mathrm{K}$ :

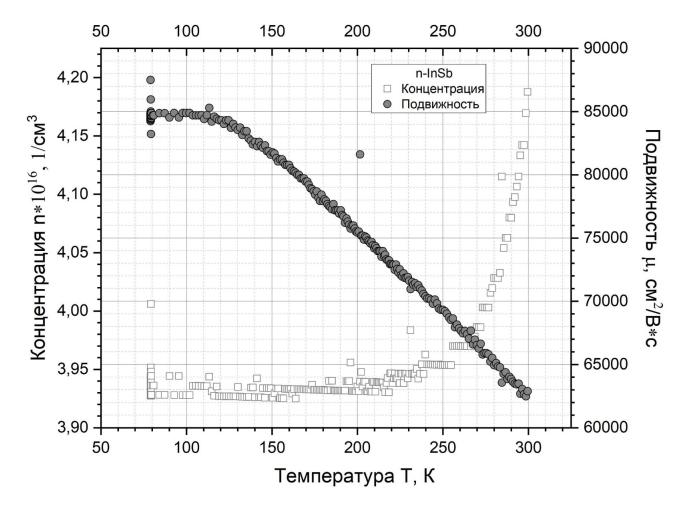


Рис. 3: Зависимость концентрации и подвижности носителей заряда от температуры

На компьютере наблюдалась зависимость концентрации и подвижности от температуры, по знаку параметров (отрицательный) можно определить тип проводимости – n тип.

Оценим концентрацию носителей заряда:

$$n_i = n = p = \sqrt{N_c N_v} \exp\left(\frac{-E_g}{2k_0 T}\right)$$
, где  $N_c = 2\left(\frac{2\pi m_n k_0 T}{h^2}\right)^{3/2} u N_v = 2\left(\frac{2\pi m_p k_0 T}{h^2}\right)^{3/2}$ 

где  $E_g$  - ширина запрещенной зоны,  $m_n$  и  $m_p$  — эффективная масса электронов и дырок,  $k_0$  - постоянная Больцмана , h - постоянная Планка. Коэффициенты  $N_c$  и  $N_v$  отражают эффективную плотность энергетических состояний соответственно в зоне проводимости и в валентной зоне.

Отсюда можем получить значение при температуре  $T=300~\mathrm{K}$ :  $n=5.17\cdot 10^{16}\mathrm{cm}^{-3}$ , что отличается от экспериментальных данных примерно на 25%. По порядку величины оценка подтверждается.

## Подведение итогов

При помощи автоматизированной установки для гальваномагнитных измерений были определены основные электрофизические характеристики InSb в области температур  $80 \div 300$  K. Установлено, что тип проводимости — электронный (n), концентрация носителей заряда  $n = (3.92 \div 4.19) \cdot 10^{16} \text{cm}^{-3}$ , подвижность =  $(6.2 \div 8.6) \cdot 10^4 \text{cm}^2/\text{B} \cdot \text{c}$ .